

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 θ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ: $|\Delta(\text{LogI})|$

最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数

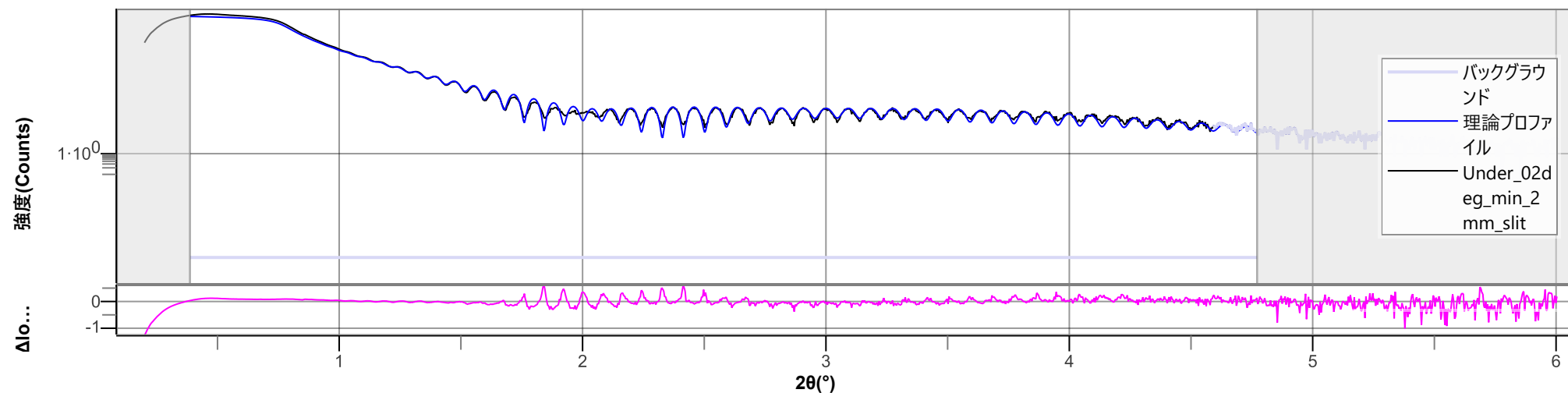
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm) <th>	密度(g/cm ³) <d>	粗さ(nm) <rg>
<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe ₂ O ₃	1.015 Const	2.47500 Const	1.209 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe ₂ O ₃	2.213 Const ±0.008 精密化	4.95000 Const	0.121 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	93.394 Const ±0.02 一最大 精密化	7.86952 Const	0.499 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	4.689 Const	3.93700 Const	0.466 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...